昭和54年 ／ 昭和55年

| 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

イベント:
- 対インテル第1回打合せ
- 対インテル第2回打合せ
- 端末(亜)打合せ
- 端末・伝送・中研打合せ
- 対インテル第3回打合せ
- システム仕様書発行
- 回路検討会
- 回路設計完了
- モック・アップ・デバグ開始
- モックアップ・デバグ完了
- レイアウト設計完了
- レイアウト検討会
- 評価仕様書第1版発行
- 第1次試作(4ミクロン)
- 第2次試作(4ミクロン)

工程:
- 調査
- システム設計
- 論理・回路設計
- マスク・レイアウト設計
- モック・アップ作製・調整
- シミュレーション・テストパターン

昭和56年 ／ 昭和57年

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

イベント:
- 第3次試作(4ミクロン)
- ISSCC・新聞発表
- 社外ユーザへの紹介開始
- 第4次試作(4ミクロン)
- ELECTRONICS
- サンプル出荷開始
- 評価仕様書発行
- 第1次試作(3ミクロン)
- NEC技報
- WESCON
- 日経エレクトロニクス
- 第2次試作(3ミクロン)
- R-IQ4移管
- 日本工業技術センター

工程:
- シミュレーション・テストパターン

μPD7220 (GDC) 開発履歴概要

	1978	1979	1980	1981	1982
Jan				- Trial production #3 (4μ)	- Seminar at JIEC
Feb		- Meeting with Intel #2 at NEC	- Start of breadboard debug	- ISSCC - Start of sales promotion for external companies	
Mar					
Apr		- Meetings with peripheral division	- Completion of breadboard debug	- Trial production #4 (4μ)	
May		- Meetings with in-house divisions		- Electronics magazine - Start of sampling	
Jun			- Mask layout review session		
Jul		- Meeting with Intel #3 at NEC - Issuance of system specification	- Completion of mask layout	- Trial production #1 (3μ)	
Aug			- Issuance of evaluation specification		
Sep			- Trial production #1 (4μ)	- WESCON	
Oct		- Completion of logic design - Logic design review session		- Nikkei Electronics	
Nov			- Trial production #2 (4μ)		
Dec	- Meeting with Intel #1 at Intel			- Trial production #2 (3μ) - Mass production transfer (3μ)	

Abstract History of μPD7220 (Graphics Display Controller) Development (from 12/1978 – 1/1982)